

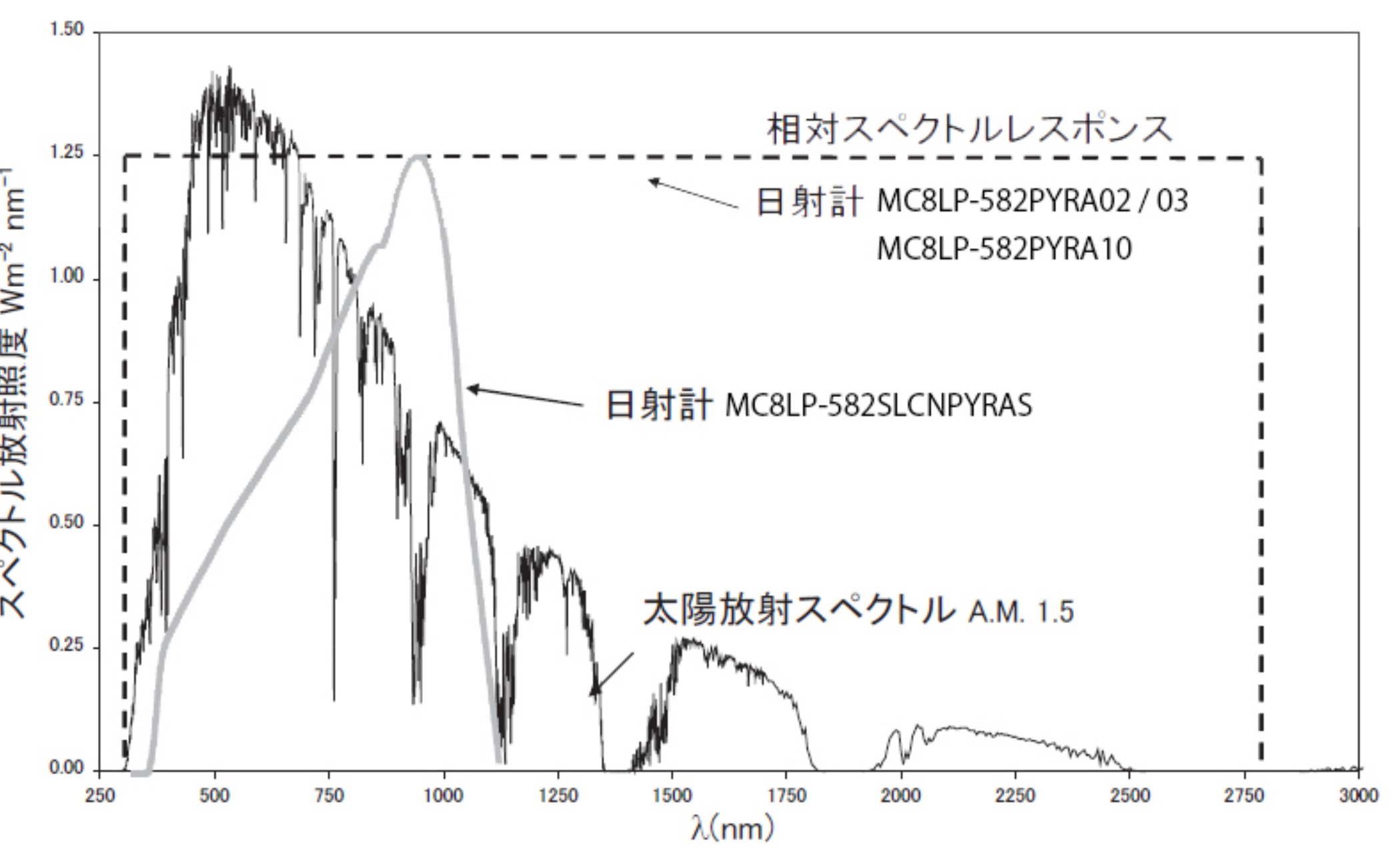
- MC8LP-582SLCNPYRAS シリコンフォトダイオード積算用日射計
- MC8LP-582PYRA**-**S 全天日射計プローブ（クラス1/クラス2/二次標準）

全天日射量測定用プローブ、スペクトル範囲400～1100nm、測定範囲0～2000W/m²、SICRAMモジュール付。全天日射計MC8LP-582PYRA10（二次標準）、MC8LP-582PYRA02（クラス1）、MC8LP-582PYRA03（クラス2）もSICRAMモジュールおよびケーブルを装備してポータブル測定器に使用できます。

測定範囲 (W/m ²)	0.1・10 ⁻³ ～999.9・10 ⁻³	1.000 ～19.999	20.00 ～199.99	200.0 ～1999.9
分解能 (W/m ²)	0.1・10 ⁻³	0.001	0.01	0.1
スペクトル範囲	400nm～1100nm			
校正不確かさ	<3%			
f ₁ (余弦則に準ずる 応答)	<3%			
f ₃ (直線性)	<1%			
f ₄ (測定器読み誤差)	±1digit			
f ₅ (疲労)	<0.5%			
1年後のドリフト	<2%			
動作温度	0～50℃			



代表応答カーブ



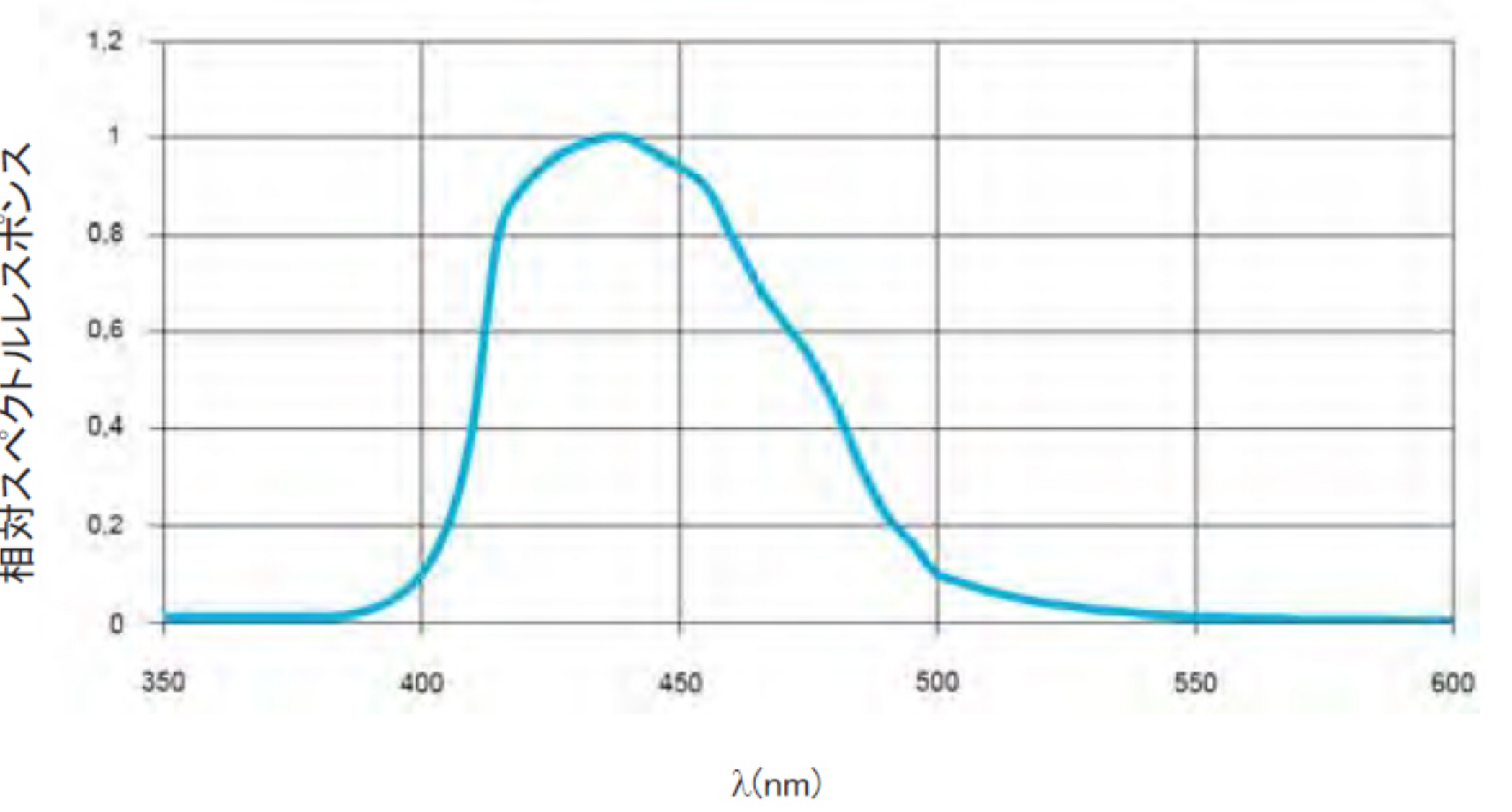
- MC8LP-582BLUES 青色光有効放射測定プローブ

青色スペクトル帯放射照度測定(W/m²)プローブ。フォトダイオード、フィルタ、余弦則補正ディフューザで構成。当プローブのスペクトル応答カーブにより、スペクトル範囲380～550nmにおける、青色光に起因する損傷(ACGIH/ICNIPP標準によるB(λ)カーブ)に対して有効な放射測定が可能。このスペクトル域の放射光は網膜に対する光化学的損傷を生じさせます。他の用途は新生児黄疸治療で使用される青色光放射のモニタリング。測定範囲0.1・10⁻³～2000Weff/m²、SICRAMモジュール付。

測定範囲 (W/m ²)	0.1・10 ⁻³ ～999.9・10 ⁻³	1.000 ～19.999	20.00 ～199.99	200.0 ～1999.9
分解能 (W/m ²)	0.1・10 ⁻³	0.001	0.01	0.1
スペクトル範囲	380nm～550nm 青色光損傷アクションカーブB(λ)			
校正不確かさ	<10%			
f ₁ (余弦則に準ずる 応答)	<6%			
f ₃ (直線性)	<3%			
f ₄ (測定器読み誤差)	±1digit			
f ₅ (疲労)	<0.5%			
1年後のドリフト	<2%			
動作温度	0～50℃			



代表応答カーブ



- MC8LP-582AUVEFFS 全有効放射照度測定用複合プローブ

UVアクションカーブ(CEI EN60335-2-27)準拠の重み付けによる有効総放射(W/m²)測定。複合2センサによる250～400nm域有効総放射の正確な測定、複合2センサとも余弦則補正ディフューザ付。プローブは有効総放射(Eeff)、UV-BC有効放射、UVA放射照度測定データを提供。有効総放射測定範囲0.001～20W/m²、B.C有効放射測定範囲0.001～20W/m²、UVA放射照度測定0.1～2000W/m²、SICRAMモジュール付。

有効総放射	
測定範囲 (W _{eff} /m ²)	0.001～19.999
分解能 (W _{eff} /m ²)	0.001
スペクトル範囲	紅斑測定UVアクションカーブ(250～400nm)
校正不確かさ	<15%
f ₃ (直線性)	<3%
f ₄ (測定器読み誤差)	±1digit
f ₅ (疲労)	<0.5%
1年後のドリフト	<2%
動作温度	0～50℃
UV放射照度	
測定範囲 (W _{eff} /m ²)	0.1～1999.9
分解能 (W _{eff} /m ²)	0.1～1999.9
スペクトル範囲	315～400nm
有効総放射	
測定範囲 (W _{eff} /m ²)	0.001～19.999
分解能 (W _{eff} /m ²)	0.001
スペクトル範囲	250～315nm



代表応答カーブ

